

Día	Lunes 11/11	Martes 12/11	Miércoles 13/11	Jueves 14/11	Viernes 15/11
8:30-10:30	Inscripción y apertura 8:30-9:00 Introducción a la cristalografía (Parte I) 9:00-10:30 G. Echeverría IFLP (CONICET-UNLP)	Ausencias sistemáticas, determinación del GE 8:30-9:30 G. Echeverría IFLP (CONICET-UNLP) Colección y procesamiento de datos RX 9:30-10:30 J. Ellena IFSC (USP, Brasil)	Uso de programas de monocristales y ejemplos 8:30-10:30 J. Ellena IFSC (USP, Brasil)	Uso de bases de datos I (Base de datos de monocristales CSD) 8:30-10:30 J. Ellena IFSC (USP, Brasil)	Uso de bases de datos II. Identificación de compuestos y empleo de bases de datos de polvos cristalinos 8:30-10:30 M. Delgado UA, Mérida, Venezuela (por internet)
10:30-11:00 REFRIGERIO					
11:00-13:00	Introducción a la cristalografía (Parte II) 11:00-13:00 G. Echeverría IFLP (CONICET-UNLP)	Reducción de datos 11:00-12:00 Métodos de resolución estructural (Parte I) 12:00-13:00 J. Ellena IFSC (USP, Brasil)	LABORATORIO I (visita laboratorio Física) 11:00 -13:00	Fundamentos de difracción de polvo y aspectos experimentales 11:00-13:00 M. S. Conconi FCEX- CETMIC (UNLP)	LABORATORIO II (visita laboratorios del IFLP, CIG e INIFTA) 11:00 -13:00
13:00-14:30 ALMUERZO					
14:30-16:30	Física de los rayos-X, generación 14:30-15:30 A. Bianchi FI (UNLP) Dispersión de rayos X por átomos y sólidos (Parte I) 15:30-16:30 G. Echeverría IFLP (CONICET-UNLP)	Métodos de resolución estructural (Parte II) 14:00-16:30 J. Ellena IFSC (USP, Brasil)	Absorción de RX 14:30-16:30 J. M. Ramallo-López INIFTA (UNLP-CONICET)	Indexación de patrones DRX de polvos cristalinos 14:30-16:00 M. S. Conconi FCEX- CETMIC (UNLP)	El método de Rietveld de refinamiento estructural 14:00-16:30 M. S. Conconi FCEX- CETMIC (UNLP)
				16:00-16:30 REFRIGERIO	
16:30-17:00 REFRIGERIO					
17:00-18:00	Dispersión de rayos X por átomos y sólidos (Parte II) 17:00-18:00 G. Echeverría IFLP (CONICET-UNLP)	Refinamiento de estructura de pequeñas moléculas 17:00-18:00 J. Ellena IFSC (USP, Brasil)	Aplicaciones: XANES y EXAFS 17:00-18:00 J. M. Ramallo-López INIFTA (UNLP-CONICET)	El método de Rietveld de refinamiento estructural 16:30-18:00 M. S. Conconi FCEX- CETMIC (UNLP)	Análisis microestructural 16:30-18:00 A. Bianchi FI (UNLP)